

<<微电路国家标准汇编>>

图书基本信息

书名：<<微电路国家标准汇编>>

13位ISBN编号：9787506648011

10位ISBN编号：7506648016

出版时间：2008-2

出版时间：中国标准

作者：本社

页数：587

字数：1128000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<微电路国家标准汇编>>

内容概要

为便于广大读者查阅和使用微电路国家标准，我社编辑出版《微电路国家标准汇编》，汇编收入截至2007年底前发布实施的国家标准，分两卷出版。

本汇编为《微电路国家标准汇编 基础及测试方法卷》，共收集有关国家标准23项。

本汇编在使用时应读者注意以下两点： 1.收入标准的出版年代不尽相同，对于其中的量和单位不统一之处及各标准格式不一致之处未做改动。

2.本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明（GB或GB/T），标准年号用四拉数字表示。鉴于部分标准是在清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分保留原样。

<<微电路国家标准汇编>>

书籍目录

基础标准 GB / T 2900.66 - 2004 电工术语半导体器件和集成电路 GB / T 3430 - 1989 半导体集成电路型号命名方法 GB / T 3431.2 - 1986 半导体集成电路文字符号 引出端功能符号 GB / T 4728.12 - 1996 电气简图用图形符号 第12部分：二进制逻辑元件 GB / T 7092 - 1993 半导体集成电路外形尺寸 GB / T 9178 - 1988 集成电路术语 GB / T 12842 - 1991 膜集成电路和混合膜集成电路术语 GB / T 14113 - 1993 半导体集成电路封装术语 GB / T 15138 - 1994 膜集成电路和混合集成电路外形尺寸 GB / T 20296 - 2006 集成电路记忆法与符号测试方法标准 GB / T 4377 - 1996 半导体集成电路 电压调整器测试方法的基本原理 GB / T 6798 - 1996 半导体集成电路 电压比较器测试方法的基本原理 GB / T 14028 - 1992 半导体集成电路模拟开关测试方法的基本原理 GB / T 14029 - 1992 半导体集成电路模拟乘法器测试方法的基本原理 GB / T 14030 - 1992 半导体集成电路时基电路测试方法的基本原理 GB / T 14031 - 1992 半导体集成电路模拟锁相环测试方法的基本原理 GB / T 14032 - 1992 半导体集成电路数字锁相环测试方法的基本原理 GB / T 14114 - 1993 半导体集成电路电压 / 频率和频率 / 电压转换器测试方法的基本原理 GB / T 14115 - 1993 半导体集成电路采样 / 保持放大器测试方法的基本原理 GB / T 14862 - 1993 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB / T 16526 - 1996 封装引线间电容和引线负载电容测试方法 GB / T 19248 - 2003 封装引线电阻测试方法 GB / T 19403.1 - 2003 半导体器件集成电路第11部分：第1篇：半导体集成电路内部目检（不包括混合电路）

<<微电路国家标准汇编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>